

**D2FL20U****200V 1.5A****特長**

- 小型SMD
- 低ノイズ
- trr=35ns

**Feature**

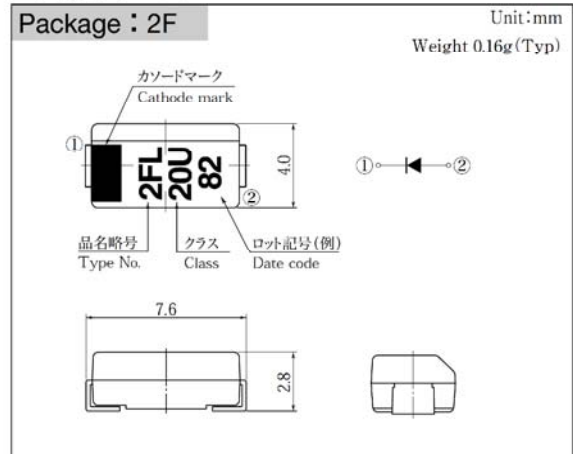
- Small SMD
- Low Noise
- trr=35ns

**用途**

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- フライホール
- 家電、OA、照明
- 通信、FA

**Main Use**

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation, Lighting
- Communication, Factory Automation

**■外観図 OUTLINE**

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

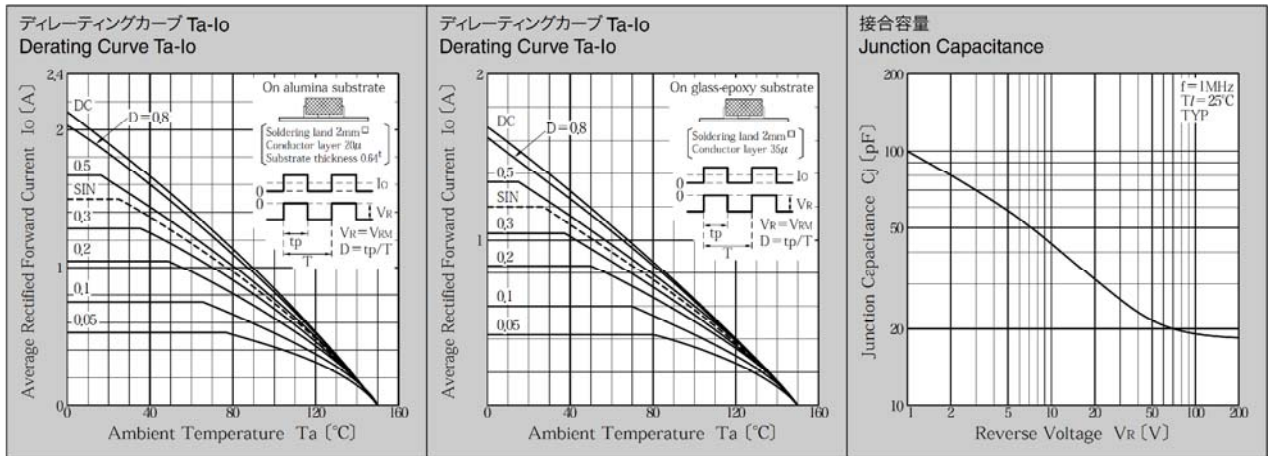
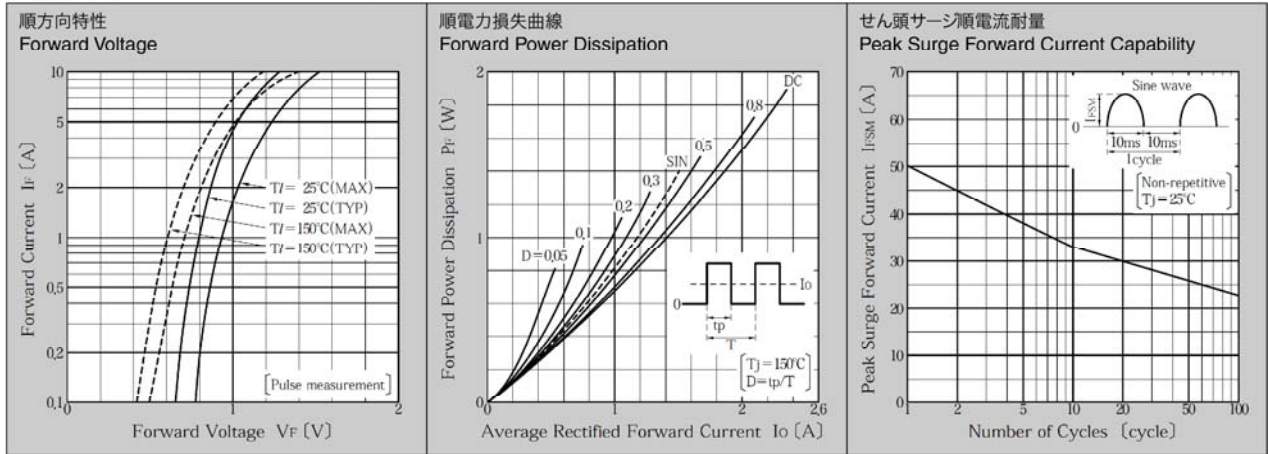
**■定格表 RATINGS****●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_I = 25^\circ\text{C}$ )**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D2FL20U	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$			-55~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	$T_j$			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{RM}$			200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	$I_o$	50Hz正弦波, 抵抗負荷, $T_a = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a = 25^\circ\text{C}$	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.5	A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1.2	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		50	A

**●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_I = 25^\circ\text{C}$ )**

順電圧 Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 1.5\text{A}$ , パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.98	V
逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R = V_{RM}$ , パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	$\mu\text{A}$
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$I_F = 0.5\text{A}$ , $I_R = 1\text{A}$	MAX 35	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{jl}$	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 24	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	$\theta_{ja}$	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 90 MAX 120	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.  
 \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
 Typicalは統計的な実力を表しています。  
 \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
 Typical is a statistical average of the device's ability.